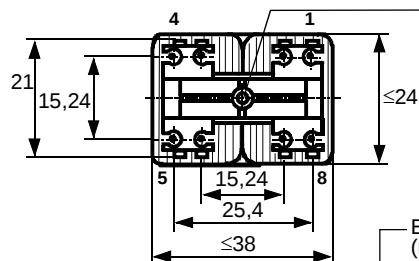


K-Nr.: K-no.:	Speicherdrossel / Storage Choke	Datum: 21.06.2012 Date:
Kunde: Typenelement / Standard Type Customer	Kd. Sach Nr.: Customers part no.:	Seite 1 von 1 Page of

Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
 Mechanical outline General tolerances

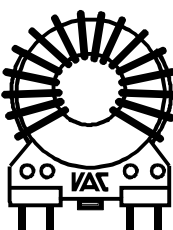
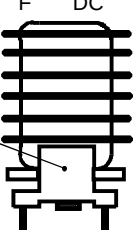
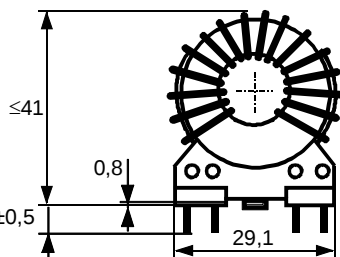


Befestigungsbohrung für
 Blechschraube BZ2,9x6,5 DIN7971
 (Fixing hole for tin screw)

Toleranz der Stiftabstände ±0,3mm
 (Tolerances grid distance)

Beschriftung:
 (marking)

DC=Date Code
 F=Factory



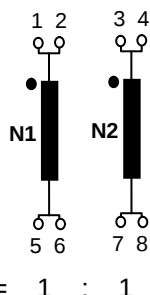
Anschlüsse:
 Connections:

Cu-verzinkt Ø 0,95 mm
 Cu-tinned

Beschriftung:
 marking

022
 F DC

Anschlußschema:
 Schematic diagram



Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):
 Operational data/characteristic data (nominal values):

$I_N = 8,5 \text{ A}$ $L = 69 \mu\text{H}$ (N1 + N2 in Reihe/series)
 $I_N = 17 \text{ A}$ $L = 17 \mu\text{H}$ (N1 + N2 parallel/parallel)
 $\Delta I = 0,2 \cdot I_N$
 $f \leq 200 \text{ kHz}$, $\tau \geq 0,25$

Umgebungstemperatur/ambient temperature: -40°C...+60°C
 Lagertemperatur/storage temperature: -40°C...+85°C

Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)
 Inspection

- | | | |
|---------------|----------|--|
| 1) (V) | M3014: | $U_{p,eff} = 0,5 \text{ kV}$, 1 s, N1 gegen/vs N2 |
| 2) (AQL 0,25) | M3214: | $L = 69 \mu\text{H} \pm 25\% - 10\%$, $I_{DC} = 8,5 \text{ A}$, $f = 100 \text{ kHz}$, $U_{AC,eff} = 250 \text{ mV}$
(N1 + N2 in Reihe/series) alternative $f = 10 \text{ kHz}$, $I_{AC,eff} = 10 \text{ mA}$ |
| 3) (AQL 1/S4) | M3011/5: | $R_{Cu1} \leq 12,2 \text{ m}\Omega$; $R_{Cu2} \leq 12,2 \text{ m}\Omega$ |
| 4) (Fix 05) | M3290: | Lötbarkeitstest nach Abschnitt 1
solderability test acc. to chapter 1 |

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur
 Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

Weitere Vorschriften: Anschlußträger: UL-gelistet
 Applicable documents: Terminal: UL-listed

Datum	Name	Index	Änderung
21.06.12	Lo	80	Mechanical outline: „preliminary values“ specified. M3290 instead of M3029. Inspection 2) adapted (current status)
			Lapidary change

Hrsg.: KB-E editor	Bearb: Lo. designer	KB-PM B: Kei. check	freig.: HS released
-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9